

第28回電子顕微鏡解析技術フォーラム

会議録

(1) 年月日：2008年2月9日

(2) 場 所：新日鐵代々木研修センター

(3) テーマ：電子顕微鏡解析技術フォーラムフォローアップ講演会

(4) 成 果：前回フォーラムのテーマであった電子回折を用いた解析技術の、特に基礎についての講演会を開催した。初心者向けの講演であったので、初参加も多かった。また各講演時間を長く取ったので、日頃の疑問点なども討論することができた。

さらに、懇親会では多くの参加があり、交流を深めることができた。

(5) 参加者：41名

(6) プログラム：

明視野・暗視野・ウィークビーム法、転位、

積層欠陥、双晶、モアレなどの解析の基礎 坂 公恭（名古屋大学）

「逆格子とは何か」から始める電子回折法の基礎、

指数付け、物質同定、構造解析など 津田 健治（東北大学）

電子回折解析ソフトの紹介 永田 文男（タ・ソリューション）

UHR TEMと暗視野撮影 鈴木 敏洋（トプコンテクハウス）

文責 鈴木 敏洋（トプコンテクハウス）